

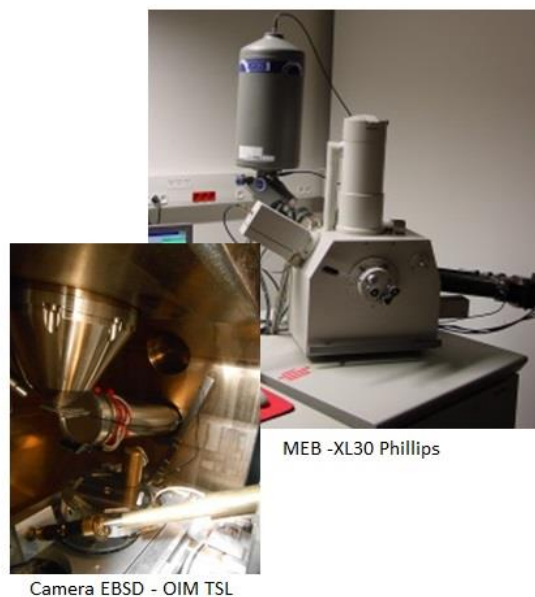
Contact: Ariane MEGUEKAM Tél: 05 87 50 23 55 mél: ariane.meguekam-sado@unilim.fr

MEB Phillips-XL30

Le MEB Phillips-XL30 permet l'**observation** et à l'**analyse** des échantillons en microscopie conventionnelle.

Il est équipé

- **Pour l'imagerie:** d'un détecteur d'électrons secondaire pour mettre en évidence la topographie, la morphologie et d'un détecteur d'électrons rétrodiffusés pour l'étude du contraste chimique.
- **Pour l'analyse chimique:** d'une microanalyse EDS (Energy dispersive spectrometry) OXFORD INCA permettant l'analyse chimique élémentaire
- **Pour l'analyse structurale:** d'un système EBSD (Electron BackScatter Diffraction), TSL OIM pour l'étude de la caractérisation micro structurale et texturale des échantillons.



Caractéristiques: Source d'électrons tungstène, tension de 1kV à 30kV, résolution 15nm à 15kV, grossissement allant jusqu'à x 100 000.

La taille de la chambre permet d'insérer des échantillons volumineux. Le MEB dispose de porte-échantillons pouvant charger 5 échantillons en même temps dans la chambre, donnant ainsi un débit élevé de caractérisations.

Ce MEB est un équipement souple d'utilisation. Il est dédié à la recherche et à l'enseignement. Pour les chercheurs des laboratoires, il est accessible en libre-service après une formation préalable dispensée par l'ingénieur du service.